TST-2における高次高調速波による パラメトリック崩壊不安定性

第11回若手科学者によるプラズマ研究会 Mar 17th – 19th ,2008 Yuuki Adachi, Takuya Oosako A. Ejiri, Y. Takase, O. Watanabe S. Kainaga, T. Masuda, M. Sasaki , J. Sugiyama H. Tojo, T. Yamaguchi

The University of Tokyo

目的、動機

・球状トカマク装置では高次高調速波(HHFW)を用いた電子加熱はプラズマ加熱の有効な手段の一つである。
・しかし近年、HHFW入射中にパラメトリック崩壊不安定性(PDI)現象によるサイドバンドの波が観測されており、加熱効率の低下が示唆される。

•発生条件を定量的に評価、理解 📄 重要である。

今回は、以前には見られなかった新しいサイドバンドが確認されたので、その定性的評価について発表する。
また、高速光計測によるポンプ波の計測に成功したのでそれについても発表する。

球状トカマク装置TST-2





大半径 $R_0 \sim 0.38m$ 小半径 $a \sim 0.25m$ アスペクト比 $R_0/a \sim 1.5$ トロイダル磁場 $B_t \sim 0.2T$ 電子密度 $n_e \sim 10^{19}m^{-3}$ プラズマ電流 $I_p \sim 120kA$

HHFW: $f_0=21MHz$ $N_{toroidal} \sim 10$ $P < 200kW \times 2$





PDIの 測定

パラメトリック崩壊不安定性(PDI)とは 媒質を介した波動の非線形相互作用 $\omega_0 = \omega_1 + \omega_2 \cdots$



新たに検出されたPDIピーク



- •水素プラズマ •f₀≈21MHz •f₁≈ f₀−Ω_H
- •f₀とf₁の間に新たなピーク(f_{un})
 ・発生条件は電子密度

放電条件:

Shot	48796
Bt	0.16T
lp	75kA
t(discharge	10ms
t(HHFW)	2ms

トロイダル磁場依存性



ライン発光強度との関係





発光変動量は第1近似で密度揺動に比例すると考えられる。

高速光計測装置



信号部:



Photo-diodeと比べた場合

 PMTの利点 信号増幅効果 SN比の向上 応答性(立ち上がり5ns)

PMTの欠点
 Dynamic rangeの低下
 平均飽和電流

高速光計測装置による測定



•ポンプ波の測定に成功した

•密度揺動によるポンプ波の広がりが見える

電子密度揺動量の見積もり



まとめ

•PDIに関して分かったこと

- HHFW入射時にH+以外のイオンによる相互作用が示唆される
- H_B線の強度と負相関がある
- 周辺プラズマの温度、密度、イオン種に影響されると考えられる
- しかし、Alfven modeの可能性も否定できない

•高速光計測による測定

ポンプ波を測定することができ、電子密度の揺動量を推定できた

周辺プラズマ中に存在するイオン種の同定

周辺部での圧力変化を測定

高速光計測を用いたPDI成分による電子密度揺動を測定する可能性の追求

backup

光量の見積もり

過去の分光器による測定から予想される光量

lines	波長	強度	光量	Total
	[nm]	[W/mm^2]	[photon/mm ² /s]	[photon/s]
Нα	654.6	1.73E-06	5.70E+12	4.14E+19
Ηβ	484.453	2.59E-07	6.31E+11	4.58E+18
Ηγ	432.906	1.90E-07	4.14E+11	3.01E+18
OIII	372.517	5.32E-07	9.98E+11	7.24E+18
OV	276.324	7.23E-07	1.01E+12	7.30E+18
CIII	463.182	9.39E-07	2.19E+12	1.59E+19
CIII'	227.462	1.13E-06	1.30E+12	9.42E+18
CV	225.095	1.46E-06	1.65E+12	1.20E+19

ピックアッププローブによる測定から



密度変化に対し光量変化が1:1であれば PDIの測定も可能

光計測の利点と欠点

 利点: ・ラインスペクトルに限ることで プラズマのエッジ部分、コア部分など大まかな 温度分布を反映した測定が可能
 ・真空容器の外で測定できる システムを組みやすく視線を自由に変えられる
 ・RFピックアッププローブと比べ プラズマの内部情報を捉えている
 ・高速測定が可能である

欠点:

・視線積分した情報
・DC成分が存在する
・高精度測定が必要となる

Single-pass計算によるHHFWの有効性



Single-pass計算によるパラメータ依存性



吸収のよい条件は
・高密度
・高電子温度
・低磁場

高βプラズマに有効





